

磁性錯体・磁性薄膜における化学と物理

岡林 潤 准教授

(東京大学大学院理学研究科
スペクトル化学研究センター)

2016年2月16日(火) 14:30–15:30

創成科学研究棟4階セミナー室A

<http://www.cat.hokudai.ac.jp/access.html>



スピン系の物性現象を理解する上で、試料全体の磁化測定ではなく、元素別に磁気状態の情報を得ることはメカニズムの解明に本質的な測定となる。放射光を用いたX線吸収分光(XAFS)およびX線磁気分光(X線磁気円二色性: XMCD)が有力な実験手法となる。本講演では、スピントロニクス素子用の磁性薄膜について、元素別な電子・磁気状態を明確にするXAFS, XMCDを用いた化学と物理について判りやすく解説する。特に、Pd, Cuなどの非磁性体に誘起される磁性について議論する。また、これらの研究分野での触媒科学と関連した今後の課題と、講演者が考える解決方法についても語りたい。

問合せ先: 触媒科学研究所・朝倉清高 (askr@cat.hokudai.ac.jp・011-706-9113)

2002年3月 東京大学 大学院理学系研究科 物理学専攻修了(博士(理学)) / 2003年 同大学 工学系研究科応用化学専攻助手 / 2006年 東京工業大学 大学院理工学研究科物性物理学専攻助教 / 2009年 東京大学 大学院理学系研究科 スペクトル化学研究センター(化学専攻兼任) 准教授

岡林先生には平成28年度から、触媒科学研究所共同利用・共同研究拠点課題等審査専門委員会委員をお願いしております。